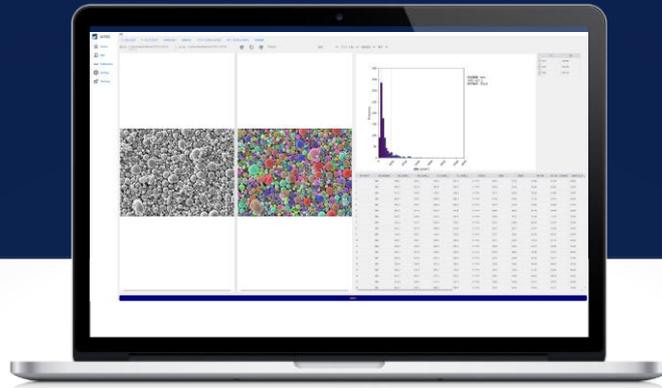


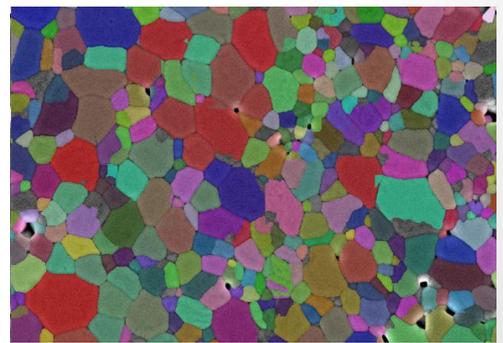
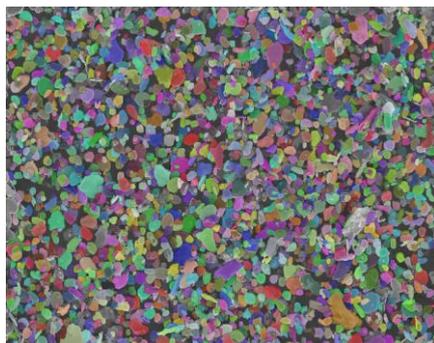
粒子 AI 图像分析软件

AIPAS



专为电子部件、电池材料等纳米微米粒子打造的 AI 图像分析软件！
无需二值化处理，一键即可精确测量粒子

- ◆ 搭载多个学习了 200 万个 / 40 多种粒子的 AI 模型.无需用户操作，立即即可开始分析
- ◆ 可自动准确识别团聚或紧密接触粒子的粒界，并精确测量每个粒子
- ◆ 可分析使用显微镜附带软件等现有工具难以处理的非规则形粒子、晶粒和烧结体
- ◆ 支持光学·电子显微镜（SEM·TEM）图像，对纳米粒子图像分析具有压倒性优势
- ◆ 无需传统的二值化处理，无需复杂设定，人人只需点击按钮即可完成分析



适用的粒子与粉体示例

- ✓ 电子材料的粒子（如 MLCC、结晶粒等）
- ✓ 电池材料粒子（正极材料、负极材料、电解质）
- ✓ 功能性粒子（无机、树脂、复合材料等）
- ✓ 金属 / 非金属粉体、金属表面结构
- ✓ 陶瓷粒子、烧结体
- ✓ 墨水、颜料粒子
- ✓ 纳米金属粒子
- ✓ 多孔体、泡沫体
- ✓ 医药粉体、化妆品材料粒子

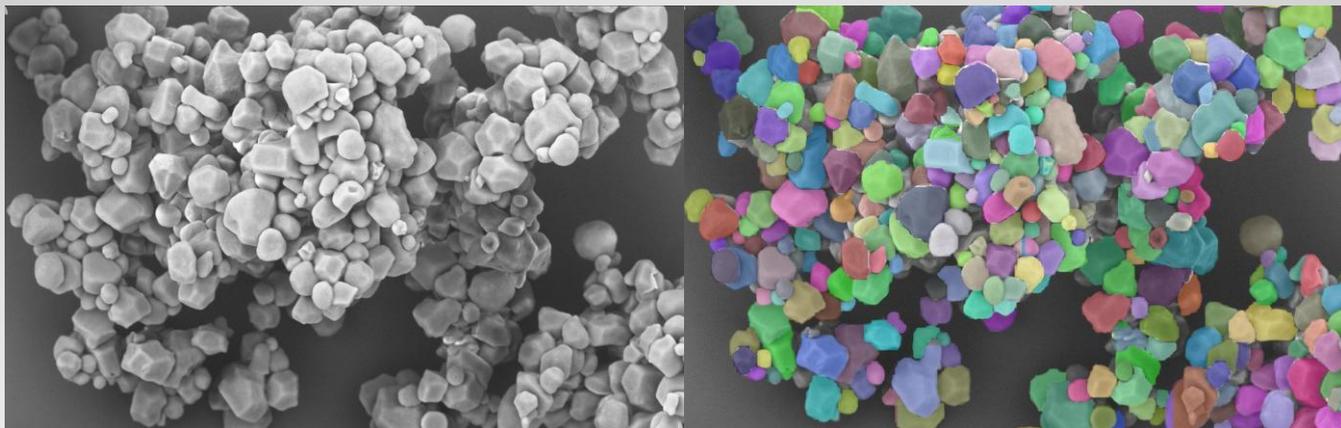
测量功能项目

- 检测总数
- 面积
- 最大长度
- 垂直费雷特直径
- 水平费雷特直径
- 费雷特径比
- 长宽比
- 重心坐标
- 中心坐标
- 周长
- 圆形度、
- 等效圆直径、半径
- 沃罗诺伊区域分割
- 重心间距
- 孔隙率
- 标准差
- D10、D50、D90

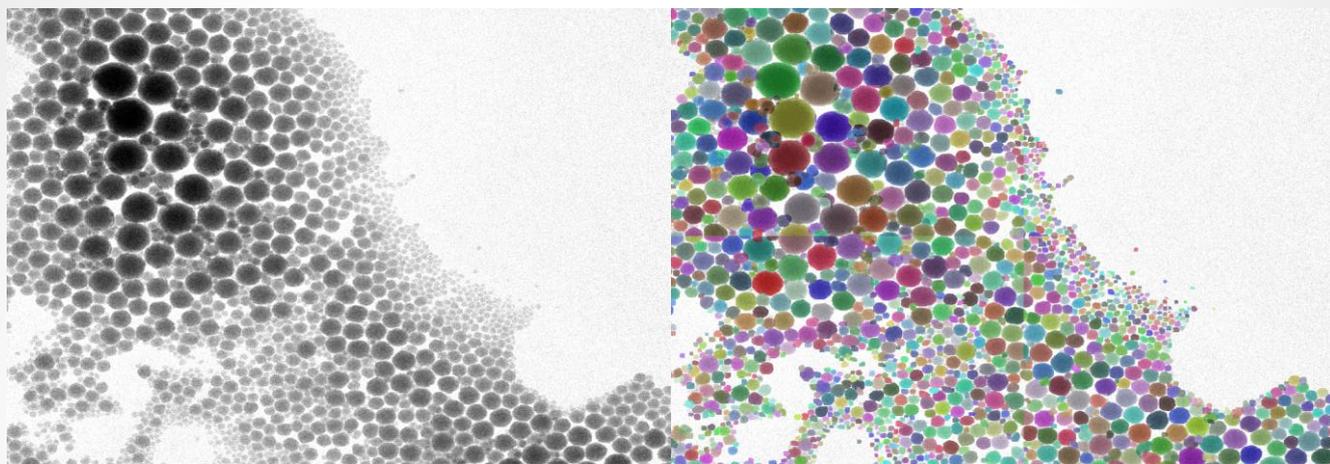
可根据需求添加额外的测量项目

搭载利用多样化数据构建的多种主题 AI 模型

适用于不规则形状的粒子，也可从二次团聚粒子中检测出一次粒子



可对纳米粒子等 TEM 图像进行高精度检测



反映客户以下需求

- ✓ 无需使用分散剂，可直接从 SEM 图像中精准切割团聚 / 紧密接触粒子区域，并实现单个识别与测量
- ✓ 由于粒度分布仪的数值不稳定，希望获取更接近真实值的粒度分布和分散度等数据
- ✓ 希望能够自行轻松构建AI解析模型，以便针对自家SEM/TEM图像进行优化
- ✓ 为了保护图像的机密性，希望使用离线分析软件



搭载预训练的 AI 模型
搭载基于大量高质量数据集训练的 AI



秒速处理多图
图像数量众多也可在短时间内完成分析作业



AI 分析
无需二值化处理
无需设置分析参数



简易检查
原始图像与分析图像并列显示，便于直观比较



测量结果
界面结构清晰，一眼即可掌握测量结果与性能



GUI
界面以易用性为核心
功能经过精挑细选



语言
支持英文与中文显示



离线使用
无需连接互联网即可作业



买断式软件包
安装后可无限制使用软件



仅需鼠标操作
无需编程，全部操作只需鼠标完成

AIPAS 特别优惠活动进行中

如您提供需分析的图像（最多30张），
我们将使用 AIPAS 免费为您进行图像分析，并提交分析报告

2025年11月1日 至 2026年3月31日

